

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-168306

(43)Date of publication of application : 22.06.2001

(51)Int.Cl. H01L 27/115  
H01L 21/8247  
H01L 29/788  
H01L 29/792

(21)Application number : 11-350841

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

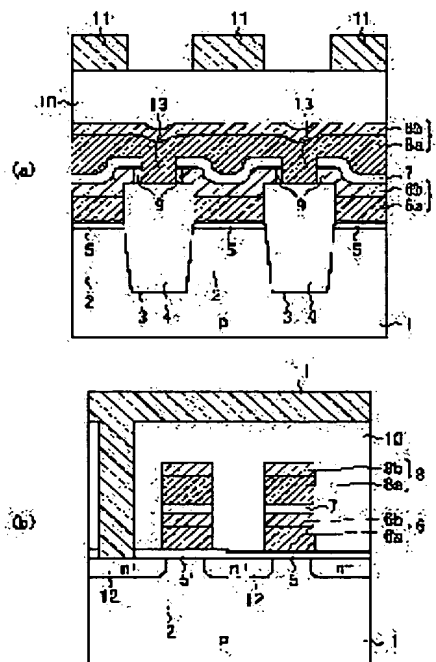
(22)Date of filing : 09.12.1999

(72)Inventor : IGUCHI SUNAO  
HIMENO YOSHIKI  
TSUNODA HIROAKI

**(54) NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD****(57)Abstract:**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a non-volatile semiconductor memory device which is improved in reliability protecting data against damage caused by a charge movement from one floating gate to another.

**SOLUTION:** Element isolation insulating films 4 are buried in a silicon substrate 1 so as to demarcate stripe-like element forming regions 2. A floating gate 6 is formed on the substrate 1 through the intermediary of a first gate insulating film 5, and a control gate 8 is formed through the intermediary of a second gate insulating film 7. Source/drain diffusion layers 12 are formed self-aligned with the control gate 8. A second gate insulating film 7 formed on the second floating gate 6 is separated together with the floating gate 6 on the element isolation insulating film 4 by a slit 13 between the adjacent memory cells.

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-168306

(P2001-168306A)

(43) 公開日 平成13年6月22日 (2001.6.22)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード <sup>*</sup> (参考)
H 0 1 L	27/115	H 0 1 L 27/10	4 3 4 5 F 0 0 1
	21/8247	29/78	3 7 1 5 F 0 8 3
	29/788		5 F 1 0 1
	29/792		

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願平11-350841

(22) 出願日 平成11年12月9日 (1999.12.9)

(71) 出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72) 発明者 井口 直

三重県四日市市山之一色町字中龍宮800番

地 株式会社東芝四日市工場内

(72) 発明者 姫野 嘉朗

三重県四日市市山之一色町字中龍宮800番

地 株式会社東芝四日市工場内

(74) 代理人 100092820

弁理士 伊丹 勝

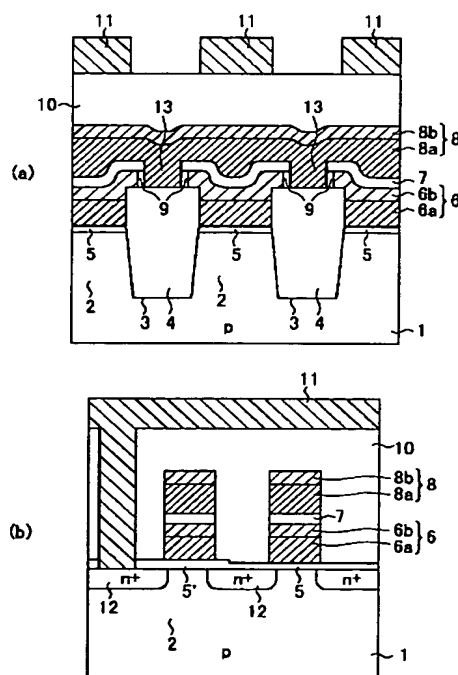
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 不揮発性半導体記憶装置及びその製造方法

## (57) 【要約】

【課題】 浮遊ゲート間の電荷移動によるデータ破壊を防止して信頼性向上を図った不揮発性半導体記憶装置を提供する。

【解決手段】 シリコン基板1にストライプ状の素子形成領域2を区画する素子分離絶縁膜4が埋め込まれる。この基板1に第1のゲート絶縁膜5を介して浮遊ゲート6が形成され、更に第2のゲート絶縁膜7を介して制御ゲート8が形成される。制御ゲート8に自己整合的にソース、ドレイン拡散層12が形成される。浮遊ゲート6上の第2のゲート絶縁膜7は、浮遊ゲート6と共に、素子分離絶縁膜4上でスリット13により隣接するメモリセル間で分離される。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体基板と、

この半導体基板に素子分離絶縁膜により区画された複数の素子形成領域と、

前記各素子形成領域に第 1 のゲート絶縁膜を介して各素子形成領域毎に分離されて形成された浮遊ゲートと、

この浮遊ゲート上に形成されて素子分離絶縁膜上で切断分離された第 2 のゲート絶縁膜と、

この第 2 のゲート絶縁膜を介して前記浮遊ゲート上に形成された制御ゲートと、

この制御ゲートに自己整合されて形成されたソース、ドレイン拡散層と、を有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

【請求項 2】 半導体基板と、

この半導体基板に素子分離絶縁膜により区画された複数の素子形成領域と、

前記各素子形成領域に第 1 のゲート絶縁膜を介して各素子形成領域毎に分離されて形成された浮遊ゲートと、

この浮遊ゲート上に形成され、且つ前記素子分離絶縁膜の表面に形成された凹部に沿って複数の素子形成領域にまたがって連続的に形成された第 2 のゲート絶縁膜と、  
この第 2 のゲート絶縁膜を介して前記浮遊ゲート上に形成された制御ゲートと、

この制御ゲートに自己整合的に形成されたソース、ドレイン拡散層と、を有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

【請求項 3】 前記第 2 のゲート絶縁膜は、シリコン酸化膜／シリコン窒化膜／シリコン酸化膜の積層膜であることを特徴とする請求項 1 又は 2 の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項 4】 半導体基板に素子形成領域を区画する素子分離絶縁膜を形成する工程と、

前記半導体基板に第 1 のゲート絶縁膜を介して第 1 のゲート電極材料膜と第 2 のゲート絶縁膜を堆積する工程と、

前記第 2 のゲート絶縁膜及びその下の第 1 のゲート電極材料膜をエッチングして前記素子分離絶縁膜上で前記第 1 のゲート電極材料膜を分離するスリットを形成する工程と、

前記第 1 のゲート電極材料膜の側面に絶縁膜を形成した後、第 2 のゲート電極材料膜を堆積する工程と、

前記第 2 のゲート電極材料膜、第 2 のゲート絶縁膜、第 1 のゲート電極材料膜を順次エッチングして、前記第 1 のゲート電極材料膜からなる浮遊ゲートと前記第 2 のゲート電極材料膜から制御ゲートをパターン形成する工程と、

前記制御ゲートに自己整合されたソース、ドレイン拡散層を形成する工程と、を有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の製造方法。

【請求項 5】 半導体基板に素子形成領域を区画する素

2

子分離絶縁膜を形成する工程と、

前記半導体基板に第 1 のゲート絶縁膜を介して第 1 のゲート電極材料膜と第 2 のゲート絶縁膜を堆積する工程と、

前記第 2 のゲート絶縁膜及びその下の第 1 のゲート電極材料膜をエッチングして前記素子分離絶縁膜上で前記第 1 のゲート電極材料膜を分離するスリットを形成する工程と、

第 3 のゲート絶縁膜及び第 2 のゲート電極材料膜を順次堆積する工程と、

前記第 2 のゲート電極材料膜、第 3 及び第 2 のゲート絶縁膜、第 1 のゲート電極材料膜を順次エッチングして、前記第 1 のゲート電極材料膜からなる浮遊ゲートと前記第 2 のゲート電極材料膜からなる制御ゲートをパターン形成する工程と、

前記制御ゲートに自己整合されたソース、ドレイン拡散層を形成する工程と、を有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の製造方法。

【請求項 6】 半導体基板に素子形成領域を区画する素子分離絶縁膜を形成する工程と、

前記半導体基板に第 1 のゲート絶縁膜を介して第 1 のゲート電極材料膜を堆積する工程と、

前記第 1 のゲート電極材料膜をエッチングして前記素子分離絶縁膜上で前記第 1 のゲート電極材料膜を分離する第 1 のスリットを形成する工程と、

前記第 1 のゲート電極材料膜及び素子分離絶縁膜上に第 2 のゲート絶縁膜を堆積する工程と、

前記第 2 のゲート絶縁膜の前記第 1 のスリットに重なる部分をエッチングして前記素子分離絶縁膜上で前記第 2 のゲート絶縁膜を分離する第 2 のスリットを形成する工程と、

第 2 のゲート電極材料膜を堆積する工程と、

前記第 2 のゲート電極材料膜、第 2 のゲート絶縁膜、第 1 のゲート電極材料膜を順次エッチングして、前記第 1 のゲート電極材料膜からなる浮遊ゲートと前記第 2 のゲート電極材料膜からなる制御ゲートをパターン形成する工程と、

前記制御ゲートに自己整合されたソース、ドレイン拡散層を形成する工程と、を有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の製造方法。

【請求項 7】 半導体基板に素子形成領域を区画する素子分離絶縁膜を形成する工程と、

前記半導体基板に第 1 のゲート絶縁膜を介して第 1 のゲート電極材料膜を堆積する工程と、

前記第 1 のゲート電極材料膜をエッチングして前記素子分離絶縁膜上で前記第 1 のゲート電極材料膜を分離するスリットを形成する工程と、

前記スリットに露出した前記素子分離絶縁膜の表面をエッチングして凹部を形成する工程と、

前記第 1 のゲート電極材料膜及び素子分離絶縁膜上に第

## 3

1 のゲート絶縁膜を介して第2のゲート電極材料膜を堆積する工程と、

前記第2のゲート電極材料膜、第2のゲート絶縁膜、第1のゲート電極材料膜を順次エッチングして、前記第1のゲート電極材料膜からなる浮遊ゲートと前記第2のゲート電極材料膜からなる制御ゲートをパターン形成する工程と、

前記制御ゲートに自己整合されたソース、ドレイン拡散層を形成する工程と、を有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の製造方法。

【請求項8】 前記第2のゲート絶縁膜は、シリコン酸化膜／シリコン窒化膜／シリコン酸化膜の積層膜であることを特徴とする請求項4乃至7のいずれかに記載の不揮発性半導体記憶装置の製造方法。

【請求項9】 前記第1のゲート電極材料膜は、前記素子分離絶縁膜の形成前に堆積される第1の導電膜と、前記素子分離絶縁膜形成後に堆積される第2の導電膜の積層膜からなることを特徴とする請求項4乃至7のいずれかに記載の不揮発性半導体記憶装置の製造方法。

【請求項10】 前記素子分離絶縁膜は、前記半導体基板に形成された溝に埋め込まれることを特徴とする請求項4乃至7のいずれかに記載の不揮発性半導体記憶装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、不揮発性半導体記憶装置とその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】浮遊ゲートと制御ゲートが積層されたスタックト・ゲート構造のメモリセルを用いて電氣的書き換え可能とした不揮発性半導体メモリ（EEPROM）が知られている。この種のEEPROMにおいては、浮遊ゲートと半導体基板の間の第1のゲート絶縁膜にはトンネル絶縁膜が用いられ、浮遊ゲートと制御ゲートの間の第2のゲート絶縁膜には通常、シリコン酸化膜（O）／シリコン窒化膜（N）／シリコン酸化膜（O）の積層構造膜であるONO膜が用いられる。

【0003】各メモリセルは、素子分離絶縁膜により区画された素子形成領域に形成される。一般に浮遊ゲート電極膜は、素子分離絶縁膜上でスリット加工することにより、制御ゲート線（ワード線）方向の分離がなされる。このスリット加工の段階ではビット線方向の浮遊ゲート分離はなされていない。そして、スリット加工された浮遊ゲート電極膜を含む基板全面にONO膜を介して制御ゲート電極膜が堆積され、この制御ゲート電極膜、ONO膜、浮遊ゲート電極膜を順次エッチングすることにより、ビット線方向に制御ゲートと浮遊ゲートの分離がなされる。この後、ソース、ドレイン拡散層が制御ゲートに自己整合的に形成される。

【0004】

## 4

【発明が解決しようとする課題】上述した従来のEEPROM構造では、ワード線方向に隣接するメモリセルの浮遊ゲートは素子分離絶縁膜上で分離されるが、この上に形成されるONO膜はワード線方向に連続的に配設される。この構造では、メモリセルを微細化し、ワード線方向の浮遊ゲートの分離幅（スリット幅）が狭くなると、隣接する浮遊ゲートの電荷蓄積状態が異なる時にONO膜を介して電荷の移動が生じることが明らかになっている。これは、ONO膜のシリコン窒化膜又はシリコン窒化膜とシリコン酸化膜の界面を横方向に電荷が移動し易いためである。従って、微細化したEEPROMにおいては、ワード線方向に隣接するメモリセルが異なるデータ状態のときに、電荷移動によりしきい値変動が生じ、場合によってはデータ破壊に至る。

【0005】この発明は、上記事情を考慮してなされたもので、浮遊ゲート間の電荷移動によるデータ破壊を防止して信頼性向上を図った不揮発性半導体記憶装置とその製造方法を提供することを目的としている。

【0006】

【課題を解決するための手段】この発明に係る不揮発性半導体記憶装置は、半導体基板と、この半導体基板に素子分離絶縁膜により区画された複数の素子形成領域と、前記各素子形成領域に第1のゲート絶縁膜を介して各素子形成領域毎に分離されて形成された浮遊ゲートと、この浮遊ゲート上に形成されて素子分離絶縁膜上で切断分離された第2のゲート絶縁膜と、この第2のゲート絶縁膜を介して前記浮遊ゲート上に形成された制御ゲートと、この制御ゲートに自己整合されて形成されたソース、ドレイン拡散層と、を有することを特徴とする。

【0007】この発明に係る不揮発性半導体記憶装置はまた、半導体基板と、この半導体基板に素子分離絶縁膜により区画された複数の素子形成領域と、前記各素子形成領域に第1のゲート絶縁膜を介して各素子形成領域毎に分離されて形成された浮遊ゲートと、この浮遊ゲート上に形成され、且つ前記素子分離絶縁膜の表面に形成された凹部に沿って複数の素子形成領域にまたがって連続的に形成された第2のゲート絶縁膜と、この第2のゲート絶縁膜を介して前記浮遊ゲート上に形成された制御ゲートと、この制御ゲートに自己整合的に形成されたソース、ドレイン拡散層と、を有することを特徴とする。

【0008】この発明に係る不揮発性半導体記憶装置の製造方法は、第1に、半導体基板に素子形成領域を区画する素子分離絶縁膜を形成する工程と、前記半導体基板に第1のゲート絶縁膜を介して第1のゲート電極材料膜と第2のゲート絶縁膜を堆積する工程と、前記第2のゲート絶縁膜及びその下の第1のゲート電極材料膜をエッチングして前記素子分離絶縁膜上で前記第1のゲート電極材料膜を分離するスリットを形成する工程と、前記第1のゲート電極材料膜の側面に絶縁膜を形成した後、第2のゲート電極材料膜を堆積する工程と、前記第2のゲ

5

ート電極材料膜、第2のゲート絶縁膜、第1のゲート電極材料膜を順次エッチングして、前記第1のゲート電極材料膜からなる浮遊ゲートと前記第2のゲート電極材料膜からなる制御ゲートをパターン形成する工程と、前記制御ゲートに自己整合されたソース、ドレイン拡散層を形成する工程と、を有することを特徴とする。

【0009】この発明に係る不揮発性半導体記憶装置の製造方法は、第2に、半導体基板に素子形成領域を区画する素子分離絶縁膜を形成する工程と、前記半導体基板に第1のゲート絶縁膜を介して第1のゲート電極材料膜と第2のゲート絶縁膜を堆積する工程と、前記第2のゲート絶縁膜及びその下の第1のゲート電極材料膜をエッチングして前記素子分離絶縁膜上で前記第1のゲート電極材料膜を分離するスリットを形成する工程と、第3のゲート絶縁膜及び第2のゲート電極材料膜を順次堆積する工程と、前記第2のゲート電極材料膜、第3及び第2のゲート絶縁膜、第1のゲート電極材料膜を順次エッチングして、前記第1のゲート電極材料膜からなる浮遊ゲートと前記第2のゲート電極材料膜からなる制御ゲートをパターン形成する工程と、前記制御ゲートに自己整合されたソース、ドレイン拡散層を形成する工程と、を有することを特徴とする。

【0010】この発明に係る不揮発性半導体記憶装置の製造方法は、第3に、半導体基板に素子形成領域を区画する素子分離絶縁膜を形成する工程と、前記半導体基板に第1のゲート絶縁膜を介して第1のゲート電極材料膜を堆積する工程と、前記第1のゲート電極材料膜をエッチングして前記素子分離絶縁膜上で前記第1のゲート電極材料膜を分離する第1のスリットを形成する工程と、前記第1のゲート電極材料膜及び素子分離絶縁膜上に第2のゲート絶縁膜を堆積する工程と、前記第2のゲート絶縁膜の前記第1のスリットに重なる部分をエッチングして前記素子分離絶縁膜上で前記第2のゲート絶縁膜を分離する第2のスリットを形成する工程と、第2のゲート電極材料膜を堆積する工程と、前記第2のゲート電極材料膜、第2のゲート絶縁膜、第1のゲート電極材料膜を順次エッチングして、前記第1のゲート電極材料膜からなる浮遊ゲートと前記第2のゲート電極材料膜からなる制御ゲートをパターン形成する工程と、前記制御ゲートに自己整合されたソース、ドレイン拡散層を形成する工程と、を有することを特徴とする。

【0011】この発明に係る不揮発性半導体記憶装置の製造方法は、第4に、半導体基板に素子形成領域を区画する素子分離絶縁膜を形成する工程と、前記半導体基板に第1のゲート絶縁膜を介して第1のゲート電極材料膜を堆積する工程と、前記第1のゲート電極材料膜をエッチングして前記素子分離絶縁膜上で前記第1のゲート電極材料膜を分離するスリットを形成する工程と、前記スリットに露出した前記素子分離絶縁膜の表面をエッチングして凹部を形成する工程と、前記第1のゲート電極材

6

料膜及び素子分離絶縁膜上に第1のゲート絶縁膜を介して第2のゲート電極材料膜を堆積する工程と、前記第2のゲート電極材料膜、第2のゲート絶縁膜、第1のゲート電極材料膜を順次エッチングして、前記第1のゲート電極材料膜からなる浮遊ゲートと前記第2のゲート電極材料膜からなる制御ゲートをパターン形成する工程と、前記制御ゲートに自己整合されたソース、ドレイン拡散層を形成する工程と、を有することを特徴とする。

【0012】この発明によると、浮遊ゲートと制御ゲートの間の第2のゲート絶縁膜を、素子分離絶縁膜を挟んで隣接するメモリセルの間に、素子分離絶縁膜上で分離することより、この第2のゲート絶縁膜を介しての隣接する浮遊ゲートの間の電荷移動が防止される。また、第2のゲート絶縁膜を素子分離膜上で完全に分離しなくても、素子分離絶縁膜表面に凹部を加工して、第2のゲート絶縁膜がこの凹部に沿って連続するようにすれば、実質的に隣接浮遊ゲート間の距離が大きくなったと等価になり、やはり隣接する浮遊ゲート間の電荷移動が防止される。従って、メモリセルを微細化した場合にも、電荷移動によるデータ破壊を防止して、信頼性向上を図ることができる。

【0013】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、この発明の実施の形態を説明する。〔実施の形態1〕図1はこの発明の実施の形態1によるNAND型EEPROMのセルアレイのレイアウトであり、図2(a)、(b)はそれぞれ図1のA-A'、B-B'断面図である。

【0014】メモリセルアレイは、シリコン基板1のp型ウェルに形成されている。シリコン基板1には、素子分離溝3が形成されてここに素子分離絶縁膜4が埋め込み形成され、この素子分離絶縁膜3によりストライプ状の素子形成領域2が区画されている。

【0015】各素子形成領域2にトンネル絶縁膜である第1のゲート絶縁膜5を介して浮遊ゲート6が形成されている。浮遊ゲート6は、素子分離前に形成された第1の多結晶シリコン（或いは非晶質シリコン）膜6aと、素子分離後に形成された第2の多結晶シリコン（或いは非晶質シリコン）膜6bの二層構造であり、各メモリセル毎に分離されている。浮遊ゲート6上には、第2のゲート絶縁膜7を介して制御ゲート8が形成されている。制御ゲート8は、多結晶シリコン（或いは非晶質シリコン）膜8aとタングステン・シリサイド(WSi)膜8bの二層構造である。制御ゲート8は、図2(a)の断面で複数の素子形成領域2にまたがって連続的にパターン形成され、これがワード線WLとなる。

【0016】浮遊ゲート6と制御ゲート8の間の第2のゲート絶縁膜7は、ONO膜である。この実施の形態において、この第2のゲート絶縁膜7は、図2(a)の断面に示すワード線WL方向について、各浮遊ゲート6上のみ配置されるように、素子分離絶縁膜4上のスリッ

7

ト13により分離されている。従って、浮遊ゲート6の側面にはシリコン酸化膜9が形成され、これにより制御ゲート8との分離がなされている。制御ゲート8に自己整合的にソース、ドレイン拡散層12が形成されて、複数のメモリセルが直列接続されたNAND型セルユニットが構成される。

【0017】NAND型セルユニットの一端ドレイン側は、制御ゲート8と同時に形成される選択ゲート13が配置され、そのドレイン拡散層にビット線(BL)11が接続される。選択ゲート13部は、メモリセルのゲート部と同様の積層ゲート構造を持つが、第1層ゲート電極材料膜は浮遊ゲートとしては分離されず、二層が一体として所定箇所短絡されて選択ゲート13となる。また、この選択ゲート13部の第1のゲート絶縁膜5'はメモリセル領域のそれより厚く形成される。NANDセルユニットの他端ソース側は示していないが、ドレイン側と同様に構成される。

【0018】この実施の形態によるEEPROMの具体的な製造工程を、図2(a)(b)の断面に対応する工程断面図である図3(a)(b)～図8(a)(b)を参照して説明する。図3(a)(b)に示すように、シリコン基板1にまず、第1のゲート絶縁膜5として、10nmのシリコン酸化膜を形成し、この上にゲート電極材料膜である60nmの第1の多結晶シリコン膜6aを堆積し、更に素子分離加工のためのマスク材21を堆積する。なお選択ゲートトランジスタ領域にはセルトランジスタ領域に比べて厚いゲート絶縁膜5'を形成する。マスク材21は、シリコン窒化膜とシリコン酸化膜の積層膜である。このマスク材21を素子形成領域上に残すようにパターン形成し、これを用いて多結晶シリコン膜6a、第1のゲート絶縁膜5、5'をエッチングし、更に基板1をエッチングして、素子分離溝3を形成する。

【0019】この後、O<sub>2</sub>雰囲気中で1000℃の加熱を行い、図4(a)(b)に示すように、素子分離溝3の内壁に6nm程度のシリコン酸化膜22を形成する。続いて、プラズマCVDによりシリコン酸化膜を堆積し、これをCMP処理により平坦化して素子分離溝3内に素子分離絶縁膜4として埋め込む。その後、900℃の窒素雰囲気中で900℃の加熱処理を行った後、マスク材21を除去する。シリコン窒化膜の除去は150℃の燐酸処理による。

【0020】その後、図5(a)(b)に示すように、ゲート電極材料膜として、減圧CVD法によりリンがドーパされた第2の多結晶シリコン膜6bを堆積し、続いて、第2のゲート絶縁膜7となるONO膜を堆積する。そして、素子分離絶縁膜4上に開口を持つレジストパターンをマスクとして、これらの第2のゲート絶縁膜7と第2の多結晶シリコン膜6bをRIEにエッチングして、図6(a)(b)に示すように、浮遊ゲート6を素子分離絶縁膜4上で分離するスリット13を形成する。

8

スリット13は、NANDセルユニットの中の複数のメモリセルにまたがる長さを持つ。第2ゲート絶縁膜7についても同時に素子分離絶縁膜4上でスリット13により分離する点が従来と異なる。

【0021】スリット13の加工により露出した多結晶シリコン膜6bの側面は、O<sub>2</sub>雰囲気中、1000℃の加熱によりシリコン酸化膜9を形成して保護する。この後、図7(a)(b)に示すように、ゲート電極材料膜として、CVD法によりリンがドーパされた多結晶シリコン膜8aを堆積し、引き続きこの上にWSi膜8bを堆積する。

【0022】次にレジストをパターン形成し、RIEにより、WSi膜8b、多結晶シリコン膜8a、ゲート絶縁膜7、多結晶シリコン膜6b、6a、ゲート絶縁膜5を順次エッチングして、図8(a)(b)に示すように、制御ゲート8を連続的なワード線WLとしてパターン形成し、また浮遊ゲート6をビット線方向について各メモリセル毎に分離する。そしてイオン注入を行って、制御ゲート8に自己整合された各メモリセルのソース、ドレイン拡散層12を形成する。

【0023】なお、選択ゲート線SGについては、下部ゲート電極材料膜6a、6bの素子分離絶縁膜4上での分離を行わず、上部ゲート電極材料膜8a、8bと一体に連続的にパターン形成される。この後、図2(a)

(b)に示すように、層間絶縁膜10を堆積し、コンタクト孔あけを行ってビット線11をパターン形成する。

【0024】以上のようにこの実施の形態によれば、浮遊ゲート6上のONO膜からなる第2のゲート電極材料膜は、浮遊ゲート6と同時に素子分離絶縁膜4上で分離されている。従って、隣接メモリセルの浮遊ゲートが近接した場合にも、電荷リークが生じることはなく、データ保持特性が優れたものとなる。

【0025】[実施の形態2]図9(a)(b)～図12(a)(b)は別の実施の形態の製造工程を示す。先の実施の形態と対応する部分には先の実施の形態と同一符号を付して詳細な説明は省く。この実施の形態でも、浮遊ゲート6上のONO膜からなる第2のゲート絶縁膜7を素子分離絶縁膜4上で分離するが、その工程が先の実施の形態と異なる。

【0026】図5(a)(b)までは、先の実施の形態と同様の工程をとる。この後、図9(a)(b)に示すように、第2のゲート絶縁膜7上にシリコン酸化膜31を堆積して、これに素子分離絶縁膜4上でスリット加工用開口13'を開ける。更にシリコン酸化膜32を堆積する。そして、エッチバックを行って、図10(a)

(b)に示すように、開口13'にシリコン酸化膜32をサイドスペーサとして残す。この状態で、シリコン酸化膜31、32をマスクとして、第2のゲート絶縁膜7と多結晶シリコン膜6bをRIEによりエッチングする。これにより、先の実施の形態と同様に、素子分離絶

9

緑膜4上で第2のゲート絶縁膜7と多結晶シリコン膜6bを分離するスリット13を加工する。

【0027】この後、シリコン酸化膜31、32をHFにより除去した後、図11(a)(b)に示すように、全面に減圧CVD法によりシリコン酸化膜33を堆積する。このシリコン酸化膜33は堆積後、O<sub>2</sub>雰囲気中、1000℃で加熱して、電荷移動等のない緻密酸化膜とする。このシリコン酸化膜33は第2のゲート絶縁膜7と共にゲート絶縁膜となり、また多結晶シリコン膜6bの側面を保護する絶縁膜となる。

【0028】この後、図12(a)(b)に示すように、多結晶シリコン膜8a、及びWSi膜8bを順次堆積し、以下先の実施の形態と同様にこれをパターンニングして、制御ゲート6及び浮遊ゲート6を形成し、ソース、ドレイン拡散層12を形成する。この実施の形態によっても、先の実施の形態と同様に、浮遊ゲート6上のONO膜からなるゲート絶縁膜7は、素子分離領域で切断分離される。従って、優れたデータ保持特性が得られる。

【0029】[実施の形態3]図13(a)(b)～図16(a)(b)は更に別の実施の形態の製造工程である。先の実施の形態では、図5(a)(b)に示すように、2層目の多結晶シリコン膜6bと第2のゲート絶縁膜7を連続的に堆積した。これに対し、この実施の形態では、図13(a)(b)に示すように、2層目の多結晶シリコン膜6bについて、第2のゲート絶縁膜7を堆積する前に、素子分離絶縁膜4上で分離するスリット13を形成する。その後、第2のゲート絶縁膜7を堆積する。

【0030】そして、第2のゲート絶縁膜6b上に、スリット13と同じ開口を持つレジスタパターン(図示せず)を形成し、第2のゲート絶縁膜6bをRIEによりエッチングして、図14(a)(b)に示すように、スリット13の部分で分離する。その後、先の実施の形態と同様に、図15(a)(b)に示すように、ゲート電極材料膜として、CVD法によりリンがドーパされた多結晶シリコン膜8aを堆積し、引き続きこの上にWSi膜8bを堆積する。

【0031】次にレジストをパターン形成し、RIEにより、WSi膜8b、多結晶シリコン膜8a、ゲート絶縁膜7、多結晶シリコン膜6b、6a、ゲート絶縁膜5を順次エッチングして、図16(a)(b)に示すように、制御ゲート8を連続的なワード線WLとしてパターン形成し、また浮遊ゲート6をビット線方向について各メモリセル毎に分離する。そしてイオン注入を行って、制御ゲート8に自己整合された各メモリセルのソース、ドレイン拡散層12を形成する。この実施の形態によっても、浮遊ゲート6上の第2のゲート絶縁膜7は、素子分離絶縁膜4上で分離されるから、先の実施の形態と同様に優れたデータ保持特性が得られる。

10

【0032】[実施の形態4]ここまでの実施の形態では、第2のゲート絶縁膜7を素子分離絶縁膜4上で切断分離したが、この実施の形態では切断分離を行わずに実質的に同等の効果を得ようというものである。この実施の形態でのセルアレイの断面構造を、図2(a)(b)に対応させて、図17(a)(b)に示す。

【0033】図17(a)(b)の構造が、図2(a)(b)と異なる点は、浮遊ゲート6を素子分離絶縁膜4上で分離するスリット13の加工を第2のゲート絶縁膜7の堆積前に行い、そのとき同時に素子分離絶縁膜4に対してリセスエッチングを行って凹部41を形成していることである。従って第1のゲート絶縁膜7は、素子分離絶縁膜4の表面に形成された凹部に沿って配設される。

【0034】図17(a)に示すように、スリット13の幅、従って素子分離絶縁膜4に形成された凹部41の幅をa、凹部41の深さをbとすると、隣接する浮遊ゲート6の間隔は実質的に、 $a+2b$ となる。この間隔を、浮遊ゲート間の電荷移動が無視できる値に設定することにより、先の各実施の形態と同様に優れたデータ保持特性が得られる。

【0035】この実施の形態の具体的な製造工程を、図17(a)の断面に着目して、図18～図25を参照して説明する。図18に示すように、シリコン基板1に第1のゲート絶縁膜5として8nm程度のシリコン酸化膜を形成し、この上に減圧CVD法により60nm程度の第1の多結晶シリコン膜6aを堆積する。連続して、減圧CVD法により、150nmのシリコン窒化膜21a、及び165nmのシリコン酸化膜21bを堆積する。

【0036】その後、850℃、30分の水素燃焼酸化処理を行った後、素子分離領域を覆うようにリソグラフィによりレジスタパターンを形成し、RIEによりシリコン酸化膜21bとシリコン窒化膜21aをエッチングしてマスク材をパターン形成する。このマスク材を用いて、RIEにより多結晶シリコン膜6a、ゲート絶縁膜5をエッチングし、更にシリコン基板1をエッチングして素子分離溝3を形成する。これによりストライプ状の素子形成領域2が区画される。

【0037】続いて、素子分離溝3の側壁に熱酸化膜を形成した後、プラズマCVD法によりシリコン酸化膜4を堆積し、これをCMP処理して平坦化して、図19に示すように素子分離溝3内に埋め込む。シリコン酸化膜21bは緩衝フッ酸により除去し、更に150℃、30分の燐酸処理によりシリコン窒化膜21aを除去して、図20の状態を得る。

【0038】この後、図21に示すように、減圧CVD法により100nmの第2の多結晶シリコン膜6bを堆積する。続いて、図22に示すように、減圧CVD法によりシリコン酸化膜42を230nm程度堆積し、これ



11

にリソグラフィとR I E工程を経て、スリット加工用開口13'を形成する。更に、図23に示すように、減圧CVD法により70nm程度のシリコン酸化膜43を堆積し、エッチバックを行って、開口13'の側壁のみにサイドスペーサとして残す。

【0039】続いて、シリコン酸化膜42、43をマスクとして、R I Eにより多結晶シリコン膜6bをエッチングして、図24に示すように、浮遊ゲートを分離するためのスリット13を加工する。更に、多結晶シリコンとの選択比の大きいR I E法により素子分離絶縁膜4の表面をエッチングして、スリット13と同じ幅で素子分離絶縁膜4に凹部41を形成する。

【0040】その後、O<sub>2</sub>プラズマとHF処理によりシリコン酸化膜42、43を除去した後、図25に示すように、17nmのONO膜からなる第2のゲート絶縁膜7を堆積し、引き続き減圧CVD法により100nmの第3の多結晶シリコン膜8a、プラズマCVD法により50nmのWSi膜8bを順次堆積する。以下、図示しないが、先の実施の形態と同様の工程を経て、各メモリのゲート部の分離とソース、ドレイン拡散層形成を行う。

【0041】図26は、隣接する浮遊ゲートを分離するスリット幅と、浮遊ゲート間の電荷移動により発生する不良ビット数の相関関係を示したものである。図の矢印は不良ビット数のばらつきの範囲を示しており、曲線がその平均値を結んだものである。メモリセルを微細化し高密度化して、スリット幅が0.14μm以下にまで小さくなると、極端に不良ビット数が多くなることがわかる。この実施の形態によると、平面上のスリット幅aに対して、素子分離絶縁膜4の凹部の深さbにより、実質的なスリット幅をa+2bとすることができる。具体的に、256MビットNAND型EEPROMにおいて、不良ビット数の仕様を2ビット/チップとしたとき、スリット幅は少なくとも0.14μmが必要となる。従ってこの実施の形態の場合、a+2b>0.14[μm]を満たすように凹部41を加工することにより、この仕様を満たすことができる。

【0042】

【発明の効果】以上述べたようにこの発明によるEEPROMでは、浮遊ゲートと制御ゲートの間の第2のゲート絶縁膜を、素子分離絶縁膜を挟んで隣接するメモリセルの間で、素子分離絶縁膜上で分離することより、隣接する浮遊ゲートの間の電荷移動が防止される。或いは、第2のゲート絶縁膜を素子分離膜上で完全に分離しなくても、素子分離絶縁膜表面に凹部を加工して、第2のゲ

12

ート絶縁膜がこの凹部に沿って連続するようにすれば、実質的に隣接浮遊ゲート間の距離が大きくなり、隣接する浮遊ゲート間の電荷移動が防止される。従って、メモリセルを微細化した場合にも、電荷移動によるデータ破壊が防止される。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施の形態1によるEEPROMのメモリセルアレイのレイアウトである。

【図2】図1のA-A'およびB-B'断面図である。

【図3】同実施の形態1の製造工程断面図である。

【図4】同実施の形態1の製造工程断面図である。

【図5】同実施の形態1の製造工程断面図である。

【図6】同実施の形態1の製造工程断面図である。

【図7】同実施の形態1の製造工程断面図である。

【図8】同実施の形態1の製造工程断面図である。

【図9】この発明の実施の形態2の製造工程断面図である。

【図10】同実施の形態2の製造工程断面図である。

【図11】同実施の形態2の製造工程断面図である。

【図12】同実施の形態2の製造工程断面図である。

【図13】この発明の実施の形態3の製造工程断面図である。

【図14】同実施の形態3の製造工程断面図である。

【図15】同実施の形態3の製造工程断面図である。

【図16】同実施の形態3の製造工程断面図である。

【図17】この発明の実施の形態4によるEEPROMの図2(a)(b)に対応する断面図である。

【図18】同実施の形態4の製造工程断面図である。

【図19】同実施の形態4の製造工程断面図である。

【図20】同実施の形態4の製造工程断面図である。

【図21】同実施の形態4の製造工程断面図である。

【図22】同実施の形態4の製造工程断面図である。

【図23】同実施の形態4の製造工程断面図である。

【図24】同実施の形態4の製造工程断面図である。

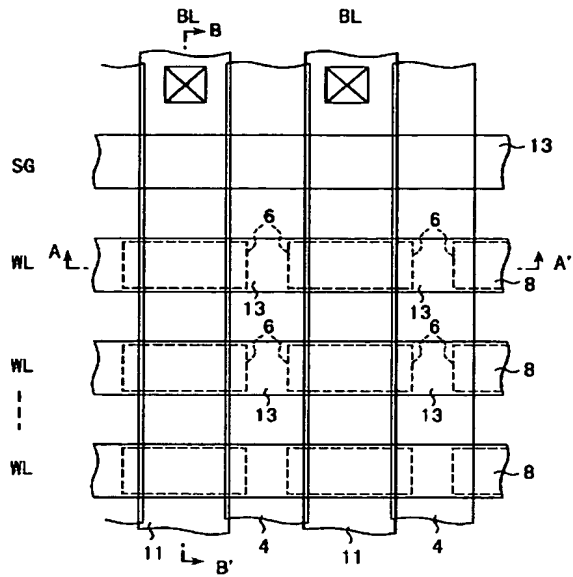
【図25】同実施の形態4の製造工程断面図である。

【図26】同実施の形態4の効果を説明するための不良ビット数とスリット幅の相関関係を示す図である。

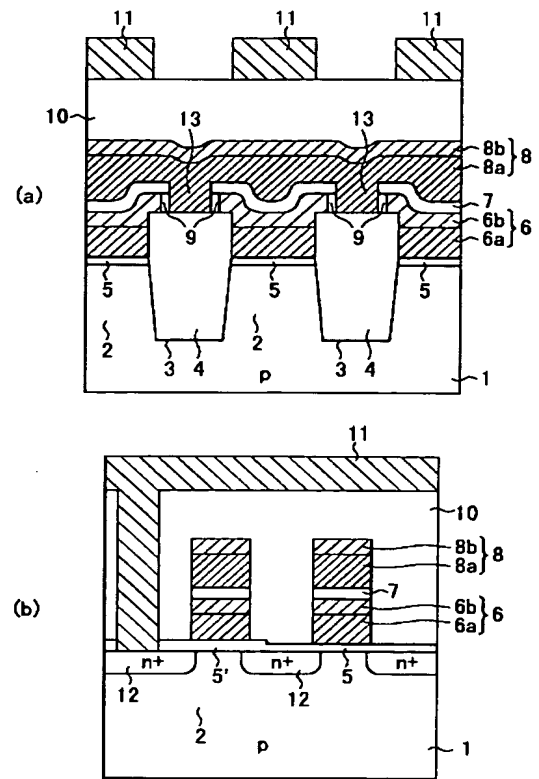
【符号の説明】

1…シリコン基板、2…素子形成領域、3…素子分離溝、4…素子分離絶縁膜、5…第1のゲート絶縁膜、6…浮遊ゲート、7…第2のゲート絶縁膜、8…制御ゲート、9…シリコン酸化膜、10…層間絶縁膜、11…ビット線、12…ソース、ドレイン拡散層、13…スリット。

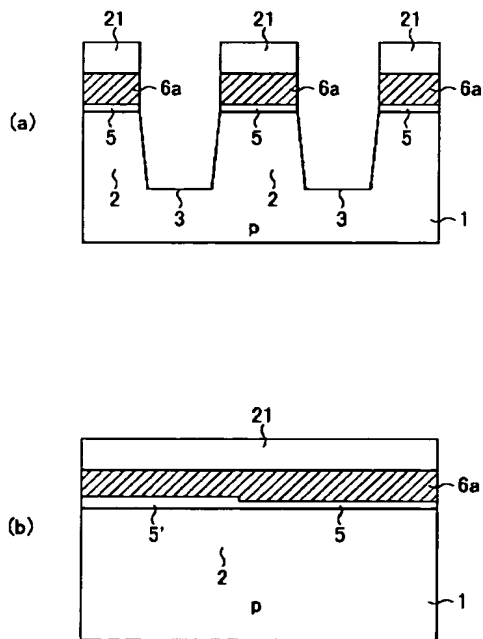
【図 1】



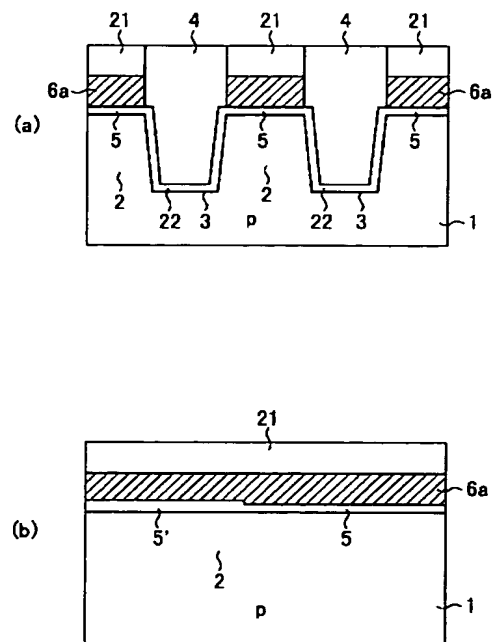
【図 2】



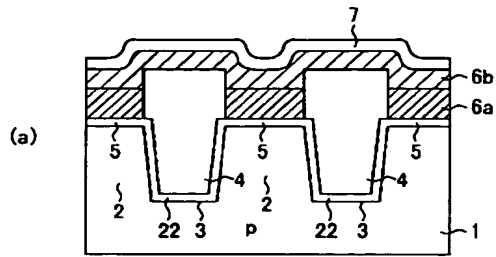
【図 3】



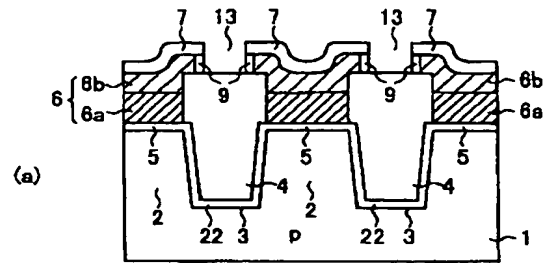
【図 4】



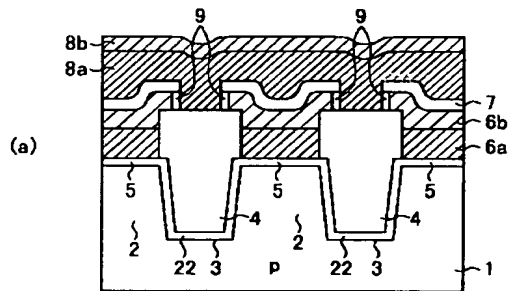
【図 5】



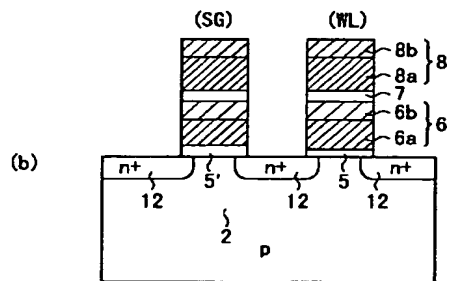
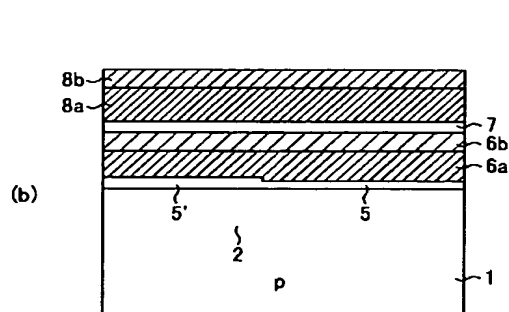
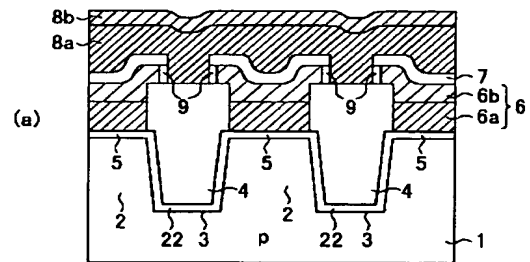
【図 6】



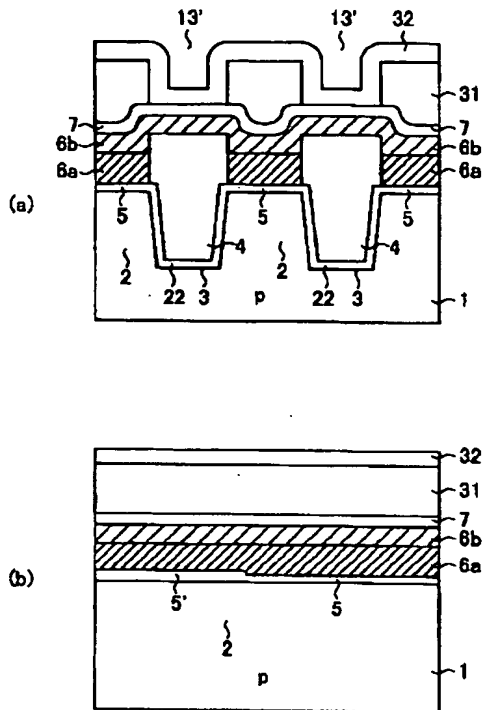
【図 7】



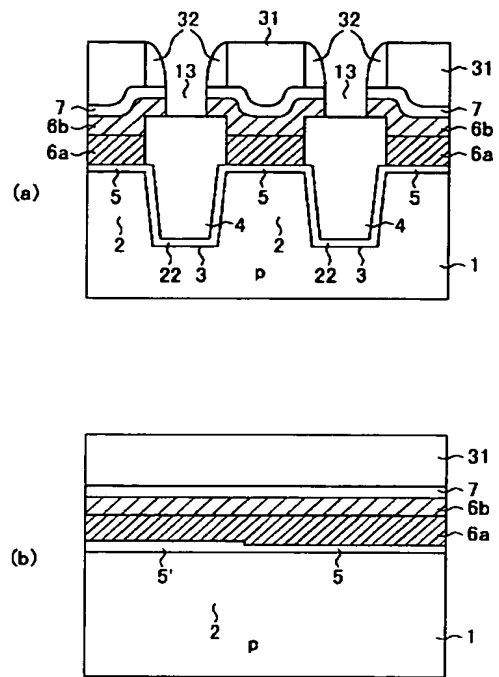
【図 8】



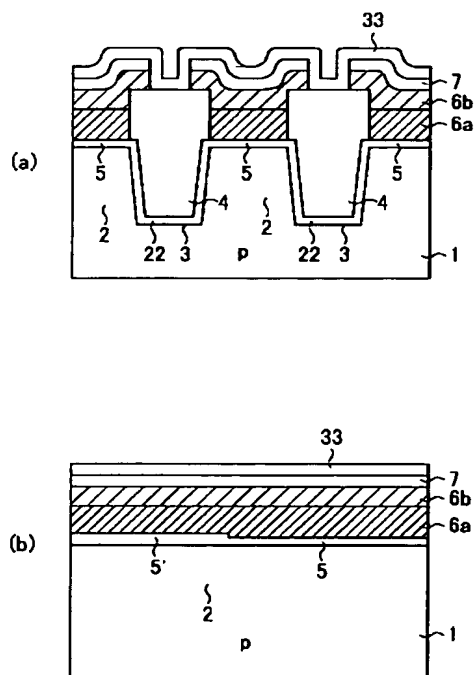
【図 9】



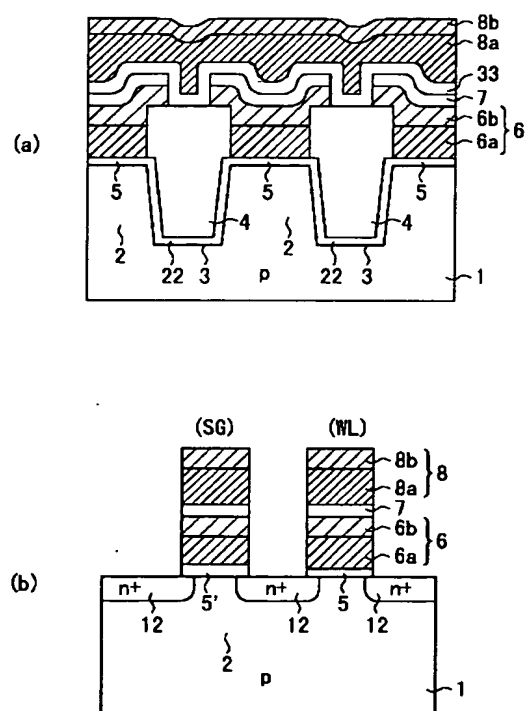
【図 10】



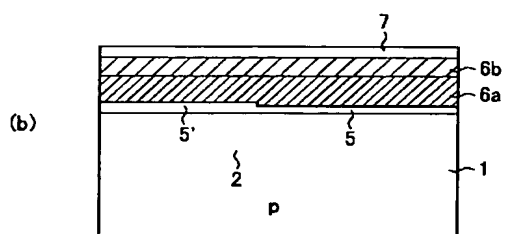
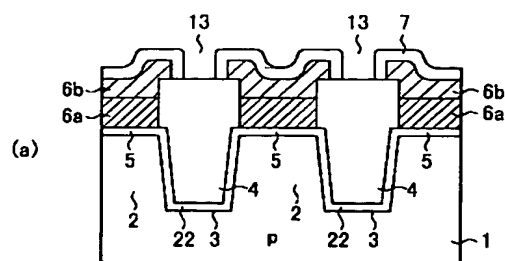
【図 11】



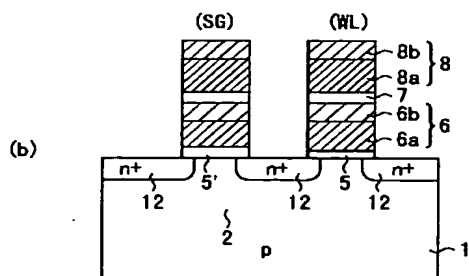
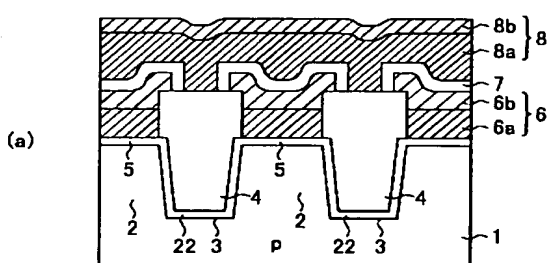
【図 12】



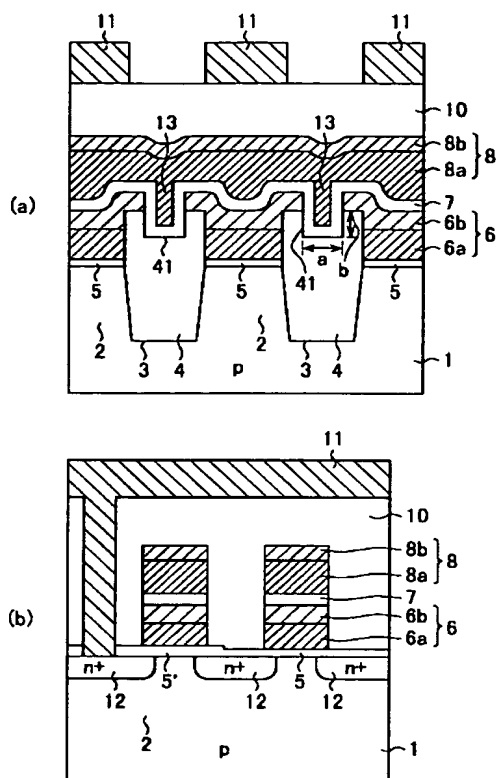
【圖 1 4】



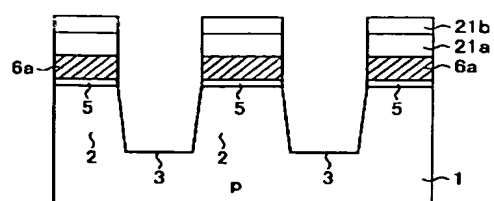
【图 16】



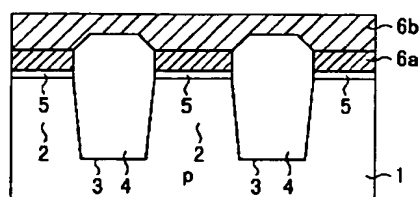
【图 17】



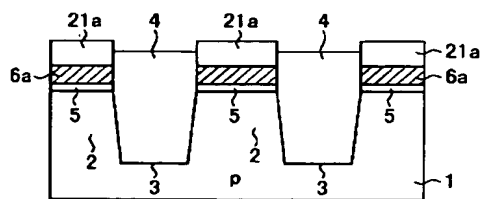
【図 18】



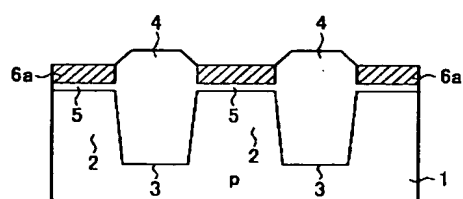
【図 2 1】



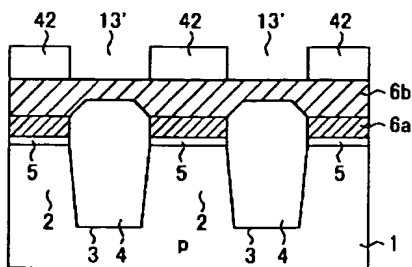
【图 19】



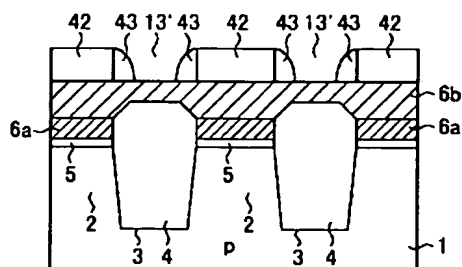
【图 20】



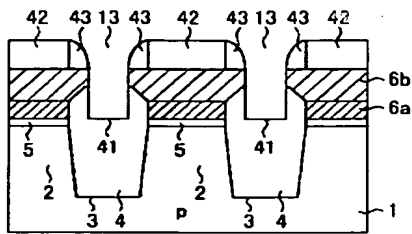
【图 2 2】



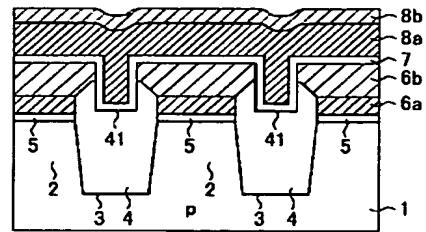
【图 23】



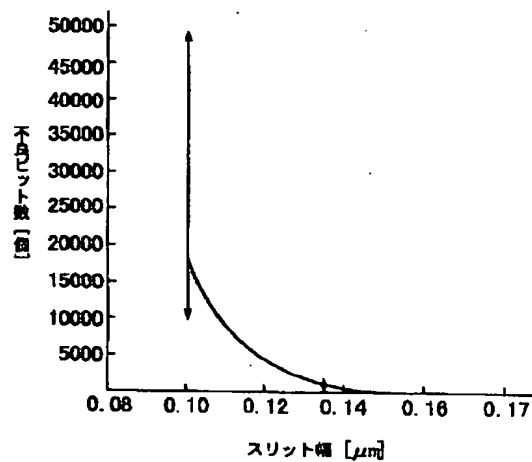
【図24】



【図25】



【図26】



フロントページの続き

(72) 発明者 角田 弘昭  
 三重県四日市市山之一色町字中龍宮800番  
 地 株式会社東芝四日市工場内

F ターム (参考) 5F001 AA25 AA43 AA63 AB08 AD51  
 AD52 AD60 AF06 AG02 AG07  
 AG12 AG21 AG30  
 5F083 EP02 EP27 EP55 ER21 GA11  
 JA04 JA35 JA39 JA53 KA05  
 NA01 PR12 PR29 PR33  
 5F101 BA07 BA28 BA36 BB05 BD32  
 BD33 BD35 BF02 BH02 BH03  
 BH09 BH16 BH19